密度汎関数理論によるGa-P同時ドープBa₈Cu₆Ge₄₀クラスレートの電子構造の研究

阿武宏明, 橋國克明

山陽小野田市立山口東京理科大学工学部電気工学科

Density Functional Theory Study of Electronic Structure of Ga–P Co-Doped Ba₈Cu₆Ge₄₀ Clathrate

Hiroaki ANNO and Katsuaki HASHIKUNI

Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Sanyo-Onoda City University

Abstract

The effect of Ga–P co-doping on the electronic structure has been investigated for p-type clathrate thermoelectric semiconductor $Ba_8Cu_6Ge_{40}$ by density functional theory (DFT) to study the possibility of carrier control. In $Ba_8Cu_6Ge_{40}$, the Fermi energy E_F lies in the valence band, and $Ba_8Cu_6Ge_{40}$ is a p-type degenerate semiconductor. For Ga–P, Ga₂–P, and Ga₃–P co-doping, the E_F lies in the conduction band, the energy gap, and the valence band, respectively, indicating that the p/n carrier type and carrier concentration change with the Ga/P ratio. In comparison with $Ba_8Cu_6Ge_{40}$, the effect of Ga–P co-doping on the energy dispersion relation at the valence band edge is greater than that at the conduction band edge. Therefore, the effect on the effective mass is greater in the valence band than in the conduction band.

Keywords: Thermoelectric generation, Phonon Glass and Electron Crystal (PGEC), Clathrate, Ba₈Cu₆Ge₄₀, Electronic structure, Ga-P co-doping, Density functional theory (DFT)

キーワード: 熱電発電, フォノン・グラス・エレクトロン・クリスタル (PGEC), クラスレート, Ba₈Cu₆Ge₄₀, 電子構造, Ga-P 同 時ドーピング, 密度汎関数理論 (DFT)

1. はじめに

カーボンニュートラルの実現に向けて様々な技術開発 と,その早期の社会への実装は重要な課題である。未利 用熱を電気エネルギーへ直接変換する熱電発電技術は省 エネルギー技術の一つとして貢献が期待されている。熱電 材料の設計・開発の指針にフォノン・グラス・エレクトロ ン・クリスタル (PGEC: Phonon Glass Electron Crystal)¹⁻³⁾ の概念がある。この設計指針に沿った候補材料の一つに クラスレート半導体がある4-6)。本研究では、中・高温度領 域のクラスレート半導体の一つであるBagCu6Ge40系に注 目している。Zintlモデル⁷⁾によるとこの系ではCu/Ge比に依 存して価電子数が変化し、それに応じてキャリア濃度が変 化する。BagCu6Ge40系に関する多くの先行研究ではn型の 特性が報告されている^{8,9)}。また, BagCu6Ge40系において Cu組成(Cu/Ge比)に依存してCu(6c)欠陥が生成されるこ とが指摘されている9-11)。一方,最近の研究でp型の Ba₈Cu_{5.7}Ge_{40.3}の特性が報告された^{12,13)}。これらの報告を 踏まえると合成プロセス(熱的過程)に依存して熱力学的 に安定な構造が異なる。つまりCu(6c)欠陥量が敏感に影 響を受け,その結果キャリアタイプにも影響しているので はないかと示唆される。熱電発電素子の基本構成はp·n 素子対であるので、p・nキャリアタイプの制御ができること が望ましい。さらに熱電特性の最適化においてキャリア濃 度の制御が重要である。

したがって本研究では多元素置換によるBa₈Cu₆Ge₄₀系 クラスレートのp・nキャリア制御の可能性を探ることを目的 とした。その可能性のひとつとして,GaNやZnO等の化合 物ワイドギャップ半導体のキャリア制御の手法として研究 されたドナー・アクセプタ同時ドーピング^{14,15)}の概念を Ba₈Cu₆Ge₄₀系クラスレートに適応してp・nキャリア制御が 可能かどうかについて調査することとした。具体的には Ba₈Cu₆Ge₄₀系クラスレートを対象に密度汎関数理論 (DFT)に基づいてGa-P同時ドーピングによる電子構造へ の効果を調査した。ここでGa置換は正孔ドープの役割,P 置換は電子ドープの役割をもつとみなし,Ba₈Cu₅GaGe₃₉P (Ga-P同時ドーピング),Ba₈Cu₅Ga₂Ge₃₈P(Ga₂-P同時 ドーピング),Ba₈Cu₅Ga₃Ge₃₇P(Ga₃-P同時ドーピング)の Ga/P比の異なる3つの場合について調査した。

2. 計算方法

本研究では、Ba₈Cu₆Ge₄₀, Ba₈Cu₅GaGe₃₉P(Ga-P同時 ドーピング), Ba₈Cu₅Ga₂Ge₃₈P(Ga₂-P同時ドーピング), およびBa₈Cu₅Ga₃Ge₃₇P(Ga₃-P同時ドーピング)を対象物 質とした。Fig. 1 にBa₈Cu₆Ge₄₀のType-I クラスレート結晶 構造(立方晶,空間群No. 223, Pm3n)¹⁶⁾を示す。またFig. 2にブリュアンゾーンを示す。構成原子の位置(Wyckoffサ イト)は, Ba原子位置2a: (0,0,0) および6d: (1/4, 1/2, 0), Cu原子位置6c: (1/4, 0, 1/2), Ge原子位置16i: (x, x, x)およ び24k: (0, y, z)である。

Fig. 3にGa-P, Ga₂-P, およびGa₃-Pの同時ドーピングの 場合の結晶構造モデルを示す。各同時ドーピングの場合 の原子位置は, Ba₈Cu₅GaGe₃₉P: Ga(6c)-P(24k), Ba₈Cu₅Ga₂Ge₃₈P: Ga(6c)-P(24k)-Ga(16i), Ba₈Cu₅Ga₃Ge₃₇P: Ga(6c)-P(24k)-Ga(16i), -Ga(16i)とし, Ga-P-Gaの結合を含む構造とした。本研究では, 6c位置 に注目した同時ドーピングを前提としているので, Gaは6c に配置し, 同時ドーピングの概念に沿ってアクセプタ(Ga)-ドナー(P) -アクセプタ(Ga)となる配置とした。Ga置換を増 やしたGa₂-PとGa₃-P同時ドーピングの場合, 上記前提で 候補となる複数の配置の中で全エネルギーが最も低い配 置を採用した。ただし, Ga-P, Ga₂-P, およびGa₃-Pのいず れの場合もGa-Ga結合排他則を採用した^{7, 17, 18)}。

密度汎関数理論 (DFT) による電子構造の計算は, Quantum ATK (ver. U-2022.12) パッケージを使用した¹⁹⁾。 計算条件の設定では,擬ポテンシャル (Pseudopotential) は Pseudo Dojo, 基底関数系 (Basis set) はMedium, 交換相関 ポテンシャル (Exchange correlation) の計算は一般化勾配 近似 (GGA: Generalized Gradient Approximation) を使用 した。電子構造計算における波数k点のサンプリング数は 9×9×9とし,状態密度 (DOS) および局所状態密度 (LDOS) の計算における波数k点のサンプリング数は24×24×24とし た。それぞれの場合において充分な収束性を確認した。そ れぞれの対象物質においてDFT計算による構造の最適化 を実施した。その決定した構造における格子定数aをTable 1 に示す。この最適化構造に対して電子構造を計算した。



Fig. 1. Crystal structure of Ba₈Cu₆Ge₄₀.



Fig.2. Brillouin zone.



Fig. 3. Structure model of $Ba_8Cu_6Ge_{40}$ co-doped with (a) Ga–P, (b) Ga₂–P, and (c) Ga₃–P.

Table 1 Lattice constant of optimized structure by DFT calculation.

Material	Lattice constant a (nm)	
Ba ₈ Cu ₆ Ge ₄₀	1.08421	
Ba8Cu5GaGe39P	1.08587	
Ba8Cu5Ga2Ge38P	1.08598	
Ba8Cu5Ga3Ge37P	1.08547	

3.結果と考察

Fig. 4はBa₈Cu₆Ge₄₀, Ba₈Cu₅GaGe₃₉P, Ba₈Cu₅Ga₂Ge₃₈P, およびBa₈Cu₅Ga₃Ge₃₇Pの電子構造計算の結果を示す。全 ての対象物質において価電子帯と伝導帯が形成され,エネ ルギーギャップ E_g が開いている。本研究のBa₈Cu₆Ge₄₀の結 果は, Johnsenら⁹⁾ やAkaiら²⁰⁾のBa₈Cu₆Ge₄₀のDFT計算の 結果と類似している。

 $Ba_8Cu_6Ge_{40}$ ではフェルミエネルギー $E_F(E=0)$ が価電子 帯の中にあり、p型の縮退半導体である。 $Ba_8Cu_5Ga_2Ge_{39}P$, $Ba_8Cu_5Ga_2Ge_{38}P$,および $Ba_8Cu_5Ga_3Ge_{37}P$ では、それぞれ E_F は伝導帯の中、エネルギーギャップの中、および価電子 帯の中にある。それぞれの場合、n型縮退半導体、真性半 導体、およびp型縮退半導体である。したがって、Ga/P比に 依存して E_F がシフトし、キャリア濃度が制御できると考えら れる。

エネルギーギャップ E_g は、 $Ba_8Cu_6Ge_{40}$ 、 $Ba_8Cu_5GaGe_{39}P$, $Ba_8Cu_5Ga_2Ge_{38}P$ 、および $Ba_8Cu_5Ga_3Ge_{37}P$ でそれぞれ 0.2386 eV、0.1300 eV、0.1004 eV、および0.1070 eVと見積も られた。つまり同時ドーピングによって E_g は減少することが 示唆された。なお、DFT計算では E_g は過小評価される傾向 があるので、 E_g の増加・減少の変化についての議論にとどめ ることにする。

全ての対象物質において価電子帯の頂上および伝導帯 の底はM点にある。伝導帯底付近に比べて価電子帯頂上 付近は比較的フラットな分散が含まれている。同時ドーピ ングによって価電子帯頂上付近の分散関係に顕著な変化 が認められる。エネルギー分散(*E-k*)関係から有効質量 を見積もった結果をTable 2に示す。これより同時ドーピン グにより価電子帯頂上付近の有効質量の変化が顕著であ ること,伝導帯底付近の有効質量が増加する傾向のある ことが確認できる。

Fig. 5は全状態密度(DOS)および構成する各元素の軌 道成分のDOSへの寄与を示す。価電子帯頂上付近は複数 の比較的フラットなバンドがあることと多谷効果(M点の



Fig. 4. Band structure for Ba₈Cu₆Ge₄₀, Ba₈Cu₅GaGe₃₉P, Ba₈Cu₅Ga₂Ge₃₈P, and Ba₈Cu₅Ga₃Ge₃₇P.

Material	Band	<i>m*/m</i> 0		
		[100] direction	[010] direction	[001] direction
Ba ₈ Cu ₆ Ge ₄₀	CB No.368	0.453	0.453	0.419
	VB No.367	-0.133	-2.849	-0.174
	VB No.366	-2.879	-0.133	-0.173
Ba8Cu5GaGe39P	CB No.369	0.564	0.484	0.493
	VB No.368	-0.636	-0.132	-0.174
	VB No.367	-0.251	1.304	-0.278
Ba ₈ Cu ₅ Ga ₂ Ge ₃₈ P	CB No.369	0.548	0.443	0.464
	VB No.368	-0.620	-0.120	-0.167
	VB No.367	-0.235	1.785	-0.270
Ba ₈ Cu ₅ Ga ₃ Ge ₃₇ P	CB No.369	0.546	0.415	0.446
	VB No.368	-0.698	-0.127	-0.166
	VB No.367	-0.226	1.924	-0.270

Table 2 Effective mass at M point.

谷間縮退度は $N_{V}=12$) によりDOSが高い。この電子構造 の特徴は、Mahan²¹⁾の議論によれば熱電材料の物性指 標である物質因子 (B因子)を高める点において都合がよ い。B因子は、 $B \propto N_{v} \mu m^{*3/2} / \kappa_L$ の関係がある。ここで、 N_v は谷 間縮退度、 μ は移動度、 m^* は有効質量、 κ_L は格子熱伝導率 である。つまり、有効質量 m^* が高く多くの谷間縮退度 N_v をもつ物質がよい。この観点から、Ba₈Cu₆Ge₄₀および同時 ドーピングした系は価電子帯も伝導帯のどちらもバンド 端がM点であり、同時ドーピングにより有効質量が増加す るバンドがあるので高いB因子が期待される。 構成する各元素の軌道成分のバンド端近傍における DOSへの寄与について議論する。Baの場合,d軌道の価電 子帯頂上付近への寄与が大きく,s軌道の伝導帯底付近 への寄与が大きい。Cuの場合,p軌道とd軌道の価電子帯 頂上付近への寄与が大きく,d軌道の伝導帯底付近への 寄与が大きい。Geの場合,p軌道の価電子帯頂上付近およ び伝導帯底付近への寄与が大きい。Ga,Pの場合,p軌道 の価電子帯頂上付近および伝導帯底付近への寄与が大き く,Geと同様にp軌道の寄与が大きいことが確認された。



Fig. 5. Density of states (DOS) for (a) $Ba_8Cu_6Ge_{40}$, (b) $Ba_8Cu_5GaGe_{39}P$, (c) $Ba_8Cu_5Ga_2Ge_{38}P$, and (d) $Ba_8Cu_5Ga_3Ge_{37}P$.

4.まとめ

DFT計算によってBa₈Cu₆Ge₄₀におけるGa-P同時ドーピ ングによる電子構造への効果について調査した。Ga-P, Ga₂-P,およびGa₃-P同時ドーピングによってフェルミエ ネルギーがシフトしp・nキャリアタイプが変化した。このこ とは、キャリア濃度をGa/P比によって制御できる可能性を 示唆する。また、同時ドーピングによりM点がバンド端であ ることは維持される。しかし、バンド端近傍の分散関係に 顕著な変化が現れる。よって有効質量への効果があるこ とが示された。M点の多谷効果を利用して高いゼーベック 係数を維持しキャリア制御できる可能性がある。しかし、 同時ドーピングによりエネルギーギャップが減少すること が示唆されており、この点は高温域のゼーベック係数を向 上させる上で不利である。今後、Ba₈Cu₆Ge₄₀の多元素置 換・組成制御について実験的研究を行い熱電特性への効 果を調査したいと考えている。

謝辞

本研究は,東京大学VDEC活動を通して,日本シノプシ ス合同会社の協力で行われたものである。

参考文献

- G. A. Slack: Design Concepts for Improved Thermoelectric Materials in *MRS Symp. Proc.*, Vol. 478, T. M. Tritt, M. G. Kanatzidis, H. B. Jr Lyon, G. D. Mahan (Eds.), (MRS Press, 1997) pp. 47–54. DOI: https://doi.org/10.1557/PROC-478-47
- 2) G. A. Slack: "New Materials and Performance Limits for Thermoelectric Cooling", in *CRC Handbook of Thermoelectrics*, edited by M. Rowe (CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 1995), pp. 407–440.
- 3) J. L. Cohn, G. S. Nolas, V. Fessatidis, T. H. Metcalf, and G. A. Slack: "Glasslike Heat Conduction in High-Mobility Crystalline Semiconductors", *Phys. Rev. Lett.*, 82, 779–782 (1999). DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.82.77
- 4) V. L. Kuznetsov, L. A. Kuznetsova, A. E. Kaliazin, D. M. Rowe: "Preparation and thermoelectric properties of A^{II}₈B^{II}₁₆B^{IV}₃₀ clathrate compounds", *J. Appl. Phys.*, 87, 7871–7875 (2000). DOI: https://doi.org/10.1063/1.373469
- 5) B. C. Sales, B. C. Chakoumakos, R. Jin, J. R. Thompson, and D. Mandrus: "Structural, magnetic, thermal, and transport properties of X₈Ga₁₆Ge₃₀

(X=Eu, Sr, Ba) single crystals", *Phys. Rev. B*, **63**, 245113 (2001). DOI:

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.63.245113

- 6) N. P. Blake, S. Latturner, J. D. Bryan, G. D. Stucky, and H. Metiu: "Band structures and thermoelectric properties of the clathrates Ba₈Ga₁₆Ge₃₀, Sr₈Ga₁₆Ge₃₀, Ba₈Ga₁₆Si₃₀, and Ba₈In₁₆Sn₃₀", *J. Chem. Phys.*, **115**, 8060 (2001). DOI: https://doi.org/10.1063/1.1397324
- 7) M. Christensen, S. Johnsen, and B. B. Iversen:
 "Thermoelectric clathrates of type I", *Dalton Trans.*,
 39, 978–992 (2010). DOI: https://doi.org/10.1039/B916400F
- 8) M. Hokazono, H. Anno and K. Matsubara: "Effect of Cu Substitution on Thermoelectric Properties of Ge Clathrates", *Mater. Trans.*, 46, 1485–1489 (2005). DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.46.1485
- 9) S. Johnsen, A. Bentien, G. K. H. Madsen, and B. B. Iversen: "Crystal Structure, Band Structure, and Physical Properties of $Ba_8Cu_{6-x}Ge_{40+x}$ ($0 \le x \le 0.7$)", *Chem. Mater.*, **18**, 4633–4642 (2006). DOI: https://doi.org/10.1021/cm061195y
- 10) N. M-Koblyuk, A. Grytsiv, P. Rogl, H. Schmid, and G. Giester: "The clathrate Ba₈Cu_xGe_{46-x-y□y}: Phase equilibria and crystal structure," *J. Solid State Chem.*, **182**, 1754–1760 (2009). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2009.04.006
- 11) J. Xu, J. Wu, H. Shao, S. Heguri, Y. Tanabe, Y. Liu, G.-Q. Liu, J. Jiang, H. Jianga and K. Tanigaki:
 "Structure and thermoelectric properties of the n-type clathrate Ba₈Cu_{5.1}Ge_{40.2}Sn_{0.7}", *J. Mater. Chem. A*, 3, 19100–19106 (2015). DOI: https://doi.org/10.1039/C5TA04168F
- 12) H. Zhang, J.-T. Zhao, M.-B. Tang, Z.-Y. Man, H.-H. Chen, and X.-X. Yang: "Structure and low temperature physical properties of Ba₈Cu₆Ge₄₀", *J. Alloys Comp.*, 476, 1–4 (2009). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2008.08.044
- 13) H. K. Sato, H. Tamaki, and T. Kanno: "Large valley degeneracy and high thermoelectric performance in p-type Ba₈Cu₆Ge₄₀-based clathrates", *Appl. Phys. Lett.*, **116**, 253901 (2020). DOI: https://doi.org/10.1063/5.0009687

- 14) T. Yamamoto and H. Katayama-Yoshida: "Materials Design for the Fabrication of Low-Resistivity p-Type GaN Using a Codoping Method", *Jpn. J. Appl. Phys.*, 36, L180–L183 (1997). DOI: https://iopscience.iop.org/article/10.1143/JJAP.36.L180
- 15) J. Zhang, K. Tse, M. Wong, Y. Zhang, and J. Zhu: "A brief review of co-doping", *Front. Phys.*, **11**, 117405 (2016). DOI: https://doi.org/10.1007/s11467-016-0577-2
- 16) G. Cordier and P. Woll: "Neue ternäre intermetallische Verbindungen mit Clathratstruktur: Ba₈(T,Si)₆Si₄₀ und Ba₆(T,Ge)₆Ge₄₀ mit T ≡ Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au", J. Less-Common Met., 169, 291–302 (1991). DOI: https://doi.org/10.1016/0022-5088(91)90076-G
- M. Christensen and B. B. Iversen: "Host Structure Engineering in Thermoelectric Clathrates", *Chem. Mater.*, **19**, 4896–4905 (2007). DOI: https://doi.org/10.1021/cm071435p
- 18) T. Uemura, K. Akai, K. Koga, T. Tanaka, H. Kurisu, S. Yamamoto, K. Kishimoto, T. Koyanagi, and M. Matsuura: "Electronic structure and thermoelectric properties of clathrate compounds Ba₈Al_xGe_{46-x}", *J. Appl. Phys.*, **104**, 013702 (2008). DOI: https://doi.org/10.1063/1.2947593
- 19) S. Smidstrup, T. Markussen, P. Vancraeyveld, J. Wellendorff, J. Schneider, T. Gunst, B. Verstichel, D. Stradi, P. A. Khomyakov, U. G. Vej-Hansen, M.-E. Lee, S. T. Chill, F. Rasmussen, G. Penazzi, F. Corsetti, A. Ojanperä, K. Jensen, M. L. N. Palsgaard, U. Martinez, A. Blom, M. Brandbyge, and K. Stokbro: "QuantumATK: an integrated platform of electronic and atomic-scale modelling tools", *J. Phys.: Condens. Matter.*, **32**, 015901 (2020). DOI: https://doi.org/10.1088/1361-648X/ab4007
- 20) K. Akai, K. Koga, and M. Matsuura: "Electronic Structure and Thermoelectric Properties of Noble Metal Clathrates: Ba₈M₆Ge₄₀(M = Cu, Ag, Au)", *Mater. Trans.*, 48, 684–688 (2007). DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.48.684
- G. D. Mahan: "Good Thermoelectrics", in *Solid State Physics*, edited by H. Ehrenreich and F. Spaepen, Vol. 51, (Academic Press, Oval Load, London, UK, 1998) pp.81–157.